

# 全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2021]12号

---

## 关于召开半导体材料标准项目论证会暨标准制修订 工作会议的通知

各标委会委员、各会员单位及起草单位：

根据国家标准化管理委员会及中国有色金属工业协会下达的关于标准制修订计划的文件精神，以及2021年标委会工作安排，现定于2021年6月8日~11日在江苏省如皋市召开半导体材料标准项目论证会暨标准制修订工作会议。

会议将对各单位提出的国家标准、行业标准和协会标准计划项目进行论证，并对11项半导体材料标准进行审定、预审和讨论。请标委会委员务必出席会议，同时请各项目申报单位、起草单位及相关单位派代表参会。现将会议有关事宜通知如下：

### 一、会议内容

1、6月9日上午，领导讲话、专家报告及企业宣讲。

2、6月9日下午，终审待报批的标准项目，论证2021年度半导体材料国家标准、行业标准及协会标准计划申报项目。

请所有项目申报单位按照《关于征集2021年半导体材料国家标准、行业标准、协会标准项目计划的通知》（半材标委[2021]3号）的要求，提前准备相关论证材料并派代表参会介绍，未派代表参会项目不予论证。

3、6月10日，对《集成电路用低密度晶体原生凹坑硅单晶抛光片》等

11 项半导体材料国家、协会标准分组进行审定、预审和讨论（具体项目见附件）。

各标准负责起草单位务必于 6 月 1 日前将标准稿件等会议资料发至标委会秘书处邮箱（tc203sc2@cnsmq.com），由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于 6 月 4 日之后在有色标准信息网（www.cnsmq.com）“标准制定工作站”栏目下载。

## 二、报到时间、地点及乘车路线

1、报到时间：2021 年 6 月 8 日。

2、报到地点：如皋开元名都大酒店（江苏省如皋市城南惠政东路 158 号，电话：0513-87278888）。

3、乘车路线：①南通兴东国际机场：乘坐 622 路至华联站下车，步行 180 米至盆景园站，乘坐 601 路至长江药用植物园站下车，乘坐如皋 217-01 路至客运站下车，乘坐如皋 201 路至电视台站下车，步行 880 米到达酒店；全程约 95 公里，打车费用约 240 元。②如皋站：乘坐如皋 201 路至电视台站下车，步行 860 米到达酒店；全程约 6 公里，打车费用约 15 元。③上海虹桥站：乘坐列车至如皋站，乘坐 201 路至电视台站下车，步行 860 米到达酒店。

## 三、组织单位及联系人

本次会议由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会、如皋市化合物半导体产业研究所联合主办，江苏秦烯新材料有限公司协办。

标委会秘书处： 杨素心 010-62629312 15010981543；

李素青 010-62565659 15652368697。

会议缴费、发票：孙紫薇 010-62257692。

## 四、会议报名及缴费

请参会代表务必于 2021 年 6 月 1 日前登录会议报名系统（<http://www.ysmeeting.net>）注册、完善个人信息、住房需求、会议组别及

单位发票信息后报名。本次会议收取会议费 850 元/人，会议期间食宿统一安排，住宿费自理。为有效保障会议用房安排和会议资料的准备，6 月 7 日之后及现场缴费收取 1200 元/人。汇款请注明：6 月如皋半材会议（个人汇款请备注单位简称）。汇款账户信息如下：

收款单位：有色金属技术经济研究院有限责任公司

开户行：中国光大银行北京中关村支行

账号：0875 0812 0100 3010 18526

附件：会议审定、预审和讨论的标准项目

#### 重要提示：

- (1) 请参加现场会议的人员报名前向所在单位报备，了解出发地及会议地具体防疫要求，经主管领导或防疫主管部门审批通过后方可外出；
- (2) 疫情防控不容松懈，请参会代表于参会途中、参会期间、返程途中务必按照相关疫情防控要求做好个人防护，并配合相关部门的防疫工作；
- (3) 报到时，请参会代表出示健康防疫码；
- (4) 因处于疫情高风险地区和中风险地区而无法出席会议的代表，可提前将对标准的反馈意见以书面形式提交至秘书处。



抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会

附件：

会议审定、预审和讨论的标准项目

序号	计划文号及编号	项目名称	牵头单位	备注
第一组				
1	国标委发[2019]22号 20192102-T-469	集成电路用低密度晶体原生凹坑硅单晶抛光片	有研半导体材料有限公司	审定
2	国标委发[2019]40号 20194173-T-469	硅片翘曲度和弯曲度的测试自动非接触扫描法	有研半导体材料有限公司	审定
3	国标委发[2020]6号 20200800-T-469	硅单晶中 III、V 族杂质含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法	乐山市产品质量监督检验所	审定
4	中色协科字[2020]8号 2020-025-T/CNIA	半导体材料痕量杂质分析用高纯可溶性聚四氟乙烯器皿	江苏赛夫特半导体材料检测技术有限公司	预审
5	国标委发[2021]12号 20210890-T-469	用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的规程	青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司	讨论
第二组				
6	国标委发[2020]37号 20202827-T-469	氮化硅粉体中氟离子和氯离子含量的测定 离子色谱法	新特能源股份有限公司	预审
7	中色协科字[2020]8号 2020-024-T/CNIA	氮化硅造粒粉	新疆晶硕新材料有限公司	预审
8	国标委发[2020]37号 20202882-T-469	金属锗化学分析方法 第3部分：痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法	广东先导稀材股份有限公司	预审
9	国标委发[2020]53号 20204894-T-469	蓝宝石单晶晶棒	天通银厦新材料有限公司	预审
10	国标委发[2020]53号 20204892-T-469	半导体单晶晶体质量的测试 X 射线衍射法	中国电子科技集团公司第四十六研究所	讨论
11	计划已公示 2020104506	蓝宝石单晶用高纯氧化铝	山东恒晶新材料有限公司	讨论